

# Chronologie des événements marquants dans la progression de nos produits industriels

En 1919, nous avons commencé à fabriquer nos premiers microscopes pour les sciences de la vie. Dix ans plus tard, nous étendions au domaine industriel la technologie de microscopie que nous avons développée. Le reste appartient à l'histoire!



**1929**

Première incursion d'Olympus dans le domaine de l'inspection industrielle grâce au microscope métallographique MC

**1955**

Lancement de notre premier microscope pour la métrologie, le micro-interféromètre MI

**1968**

Lancement des appareils de la série IFS, nos premiers produits industriels d'inspection visuelle à distance (RVI), lesquels tirent parti des développements technologiques de notre secteur médical

**1973**

Lancement du Panametrics Model 5221, premier mesureur d'épaisseur à ultrasons commercial au monde offrant la fonction de mesure multimode et d'étalonnage de la vitesse de propagation

**1984**

Lancement de l'EPOCH® 2002, premier appareil de recherche de défauts portable entièrement numérique au monde

**1988**

Lancement du 22DL, premier mesureur d'épaisseur au monde muni d'un enregistreur de données intégré

**1994**

Lancement de l'EPOCH III, notre premier appareil de recherche de défauts par ultrasons conventionnels portable à offrir des fonctions de gestion de fichiers et d'enregistrement intégré de données

└

Lancement de l'OLS1000, notre premier microscope laser

**2001**

Lancement de l'XT, notre premier analyseur XRF portable

└

Lancement de la série de vidéoscopes très prisés IPLEX™

**2003**

Lancement de l'appareil de recherche de défauts OmniScan®, premier appareil portable de ce type dans le domaine des inspections à ultrasons multiéléments

**2008**

Lancement des analyseurs XRD BTX® et TERRA®, dont la conception est enfin suffisamment compacte pour l'utilisation sur une table de travail ou sur le terrain

**2010**

Lancement de l'appareil de recherche de défauts EPOCH 60, qui est portable, fonctionnel et robuste

**2011**

Lancement de l'OmniScan MX2, l'appareil de recherche de défauts par ultrasons portable le plus vendu

**2012**

Lancement de la série DSX, premiers microscopes numériques

**2014**

Lancement de l'appareil de recherche de défauts par courants de Foucault NORTEC® 600

**2016**

Lancement du Vanta™, premier analyseur XRF portable conçu pour être conforme à l'indice de protection IP64/65

└

Lancement du vidéoscope IPLEX NX, qui marque le début de l'inspection visuelle à distance en haute définition (HD RVI™)

**2017**

Lancement de l'EPOCH 6LT, notre appareil de recherche de défauts par ultrasons offrant la plus grande portabilité jusqu'ici

└

Mise en œuvre de la plateforme Olympus Scientific Cloud™, qui marque une nouvelle étape en matière d'accès infonuagique

